

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 5 月 18 日 (2006.5.18)

【公開番号】特開 2003-319932(P2003-319932A)

【公開日】平成 15 年 11 月 11 日 (2003.11.11)

【出願番号】特願 2003-89493(P2003-89493)

【国際特許分類】

A 6 1 B 6/03 (2006.01)

【F I】

A 6 1 B 6/03 3 5 0 G

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 3 月 23 日 (2006.3.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 2】

【発明が解決しようとする課題】

ファン・ビーム方式のアルゴリズムで再構成される幾つかの公知のマルチ・スライス・ヘリカル・スキャンには、投影サンプリングのコーン・ビーム効果による誤差が存在している。再構成された画像の誤差は、画像ピクセルからシステムのイソセンタまでの距離が増すにつれて増大する。従って、システムのイソセンタの近くに位置するピクセルでは、複数の投影射線が、再構成されるピクセル位置の近くにあるのでコーン・ビーム誤差の量は比較的小さい。しかしながら、システムのイソセンタから離隔して位置するピクセルでは、投影サンプルが通過する位置と、逆投影されるピクセルの位置との間の差が大きく、コーン・ビーム誤差の量が比較的大きい。

【特許文献 1】米国特許第 6 4 2 1 4 1 1 号